

2006/11/08

(11)特許出願公開番号

特開平11-16251

(43)公開日 平成11年(1999)1月22日

(51)IntCl [*]	識別記号	F I
G 1 1 B 19/02	5 0 1	G 1 1 B 19/02 5 0 1 K
7/00		M
7/125		C
11/10	5 5 1	11/10 5 5 1 C
	5 8 1	5 8 1 E

審査請求 未請求 請求項の数26 OL (全 29 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願平9-166943

(22) 出願日 平成9年(1997)6月24日

(71)出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号

(72)発明者 池田 亨

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号 富士通株式会社内

(72) 尧明者 柳 茂知

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号 富士通株式会社内

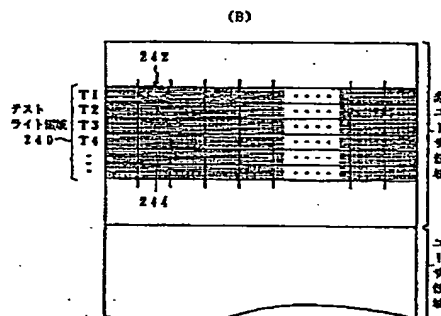
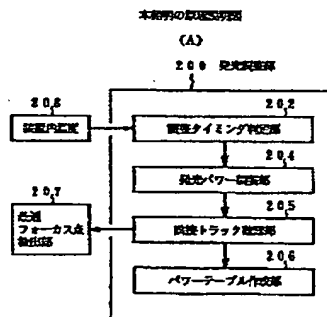
(74)代理人 弁理士 竹内 進 (外1名)

(54)【発明の名称】 光学的記憶装置

(57) 【要約】

【課題】隣接トラックのデータを破壊することのない最適な記録パワーを設定する。

【解決手段】ヒーム光を発光するレーザダイオードを有し、隣接トラック確認部205により、所定の発光パワーによるレーザダイオードの発光駆動で媒体のテスト領域に第1テストパターンの試し書きを行い、次にテスト領域の特定トラックの特定セクタ242を指定して第2テストパターンを規定回数の試し書きした後に隣接セクタ244を再生してデータ破壊のないことを確認して最適パワーとして設定する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】ビーム光を発光するレーザダイオードと、所定の発光パワーによる前記レーザダイオードの発光駆動で少なくとも隣接する2トラックに第1テストパターンと第2テストパターン順番に試し書きした後に、先に第1テストパターンの試し書きした隣接トラックを再生してデータ破壊の有無を確認し、データ破壊がなかった場合に前記試し書きした発光パワーを記録パワーとする隣接トラック確認部と、を備えたことを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項2】ビーム光を発光するレーザダイオードと、所定の発光パワーによる前記レーザダイオードの発光駆動で少なくとも隣接する3トラックの中央のトラックに第1テストパターンを、両側の2トラックに第2テストパターンを順番に試し書きした後に、先に第1テストパターンの試し書きした隣接トラックを再生してデータ破壊の有無を確認し、データ破壊がなかった場合に前記試し書きした発光パワーを記録パワーとする隣接トラック確認部と、を備えたことを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項3】請求項1又は2記載の光学的記憶装置に於いて、前記隣接トラック確認部は、媒体の隣接する複数トラックに第1テストパターン試し書きし、次に前記複数トラックの中の同一トラックの同一位置に第2テストパターンを所定回数試し書きした後に先に試し書きした隣接トラック位置を再生してデータ破壊を確認することを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項4】請求項1又は2記載の光学的記憶装置に於いて、前記隣接トラック確認部は、媒体の最内周又は最外周に存在するユーザ未使用領域の一部で試し書きして隣接トラックのデータ破壊の有無を判断することを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項5】請求項3記載の光学的記憶装置に於いて、更に、前記発光ダイオードの発光パワーの調整により最適記録パワーを決定して前記隣接トラック確認部の試し書きに使用する記録パワーの初期値を決定する記録パワー調整部を設けたことを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項6】請求項5の光学的記憶装置に於いて、前記隣接トラック確認部は、前記記録パワー調整部で決定した最適記録パワーよりも高めの記録パワー初期値を設定して試し書きすることを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項7】請求項5記載の光学的記憶装置に於いて、前記記録パワー調整部は、前記発光ダイオードの発光パワーを調整して媒体に試し書きしながら最適記録パワーを決定することを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項8】請求項5記載の光学的記憶装置に於いて、前記記録パワー調整部は、前記レーザダイオードの記録パワーを段階的に徐々に低下させながら所定のテストパターンを媒体に試し書きした後に再生して元のテストパターンと比較してデータの不一致個数を計数し、該不一致個数が所定の閾値を超える記録パワーを下限記録パ

ーとして検出し、該下限記録パワーに所定のオフセットを加算した値を最適記録パワーに決定することを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項9】請求項1又は2記載の光学的記憶装置に於いて、前記隣接トラック確認部は、隣接トラックの再生確認が正常に終了後に、試し書きした全トラックを初期化記録（イレース）することを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項10】請求項1又は2の光学的記憶装置に於いて、前記隣接トラック確認部は、隣接トラックから再生したRF信号のピーク検波信号のレベル変化が規定値以上であることを検出してデータ破壊と判断することを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項11】請求項1又は2記載の光学的記憶装置に於いて、前記隣接トラック確認部は、隣接トラックの記録データと再生データを比較し、ビット誤り個数が規定値以上に増加したことを検出してデータ破壊と判断することを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項12】請求項1又は2記載の光学的記憶装置に於いて、前記隣接トラック確認部は、隣接トラックの再生データに対するECC誤り訂正数が規定値以上に増加したことを検出してデータ破壊と判断することを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項13】請求項1又は2記載の光学的記憶装置に於いて、前記隣接トラック確認部は、試し書きにより隣接トラックのデータ破壊を判断した場合は、所定の記録下限パワーまで徐々にパワーを減少させながら試し書きを繰り返して隣接トラックのデータが破壊されない記録パワーを求めることを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項14】請求項13記載の光学的記憶装置に於いて、前記隣接トラック確認部は、媒体上での位置を変えながら2回目以降の試し書きにより隣接トラックのデータ破壊の有無を確認することを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項15】請求項13記載の光学的記憶装置に於いて、前記隣接トラック確認部は、前記記録下限パワーまで徐々にパワーを減少させて試し書きを繰り返しても隣接トラックのデータが破壊された場合は、媒体の異なる位置で再度試し書きにより記録パワーを求める処理を最初からやり直すことを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項16】請求項15記載の光学的記憶装置に於いて、前記隣接トラック確認部は、記録パワーを求める処理を最初からやり直す際に、最適フォーカス点をサーチして自動焦点制御のオフセット値を最適化した後にやり直すことを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項17】請求項16記載の光学的記憶装置に於いて、前記隣接トラック確認部は、対物レンズ位置を調整した際に、媒体戻り光から検出されたトラッキングエラー信号が最大となるレンズ位置を与えるオフセット値を最適フォーカス点とすることを特徴とする光学的記憶装置。

置。

【請求項18】請求項14記載の光学的記憶装置に於いて、前記隣接トラック確認部は、対物レンズ位置を調整した際に、媒体戻り光から検出されたRF再生信号の最大となるレンズ位置を与えるオフセット値を最適フォーカス点とすることを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項19】請求項16記載の光学的記憶装置に於いて、前記隣接トラック確認部は、対物レンズ位置を調整した際に、媒体戻り光を電気信号に変換する4分割ディテクタの総和信号が最大となるレンズ位置を与えるオフセット値を最適フォーカス点とすることを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項20】請求項1又は2記載の光学的記憶装置に於いて、前記隣接トラック確認部は、媒体のテスト領域の全トラックに、前記第1テストパターンとして最長マーク長パターンを試し書きすることを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項21】請求項20記載の光学的記憶装置に於いて、前記隣接トラック確認部は、前記最長マーク長パターンの試し書きが済んだ媒体のテスト領域の特定トラックの特定セクタ位置を指定して、前記第2テストパターンとして最短マーク長パターンを規定回数試し書きすることを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項22】請求項20記載の光学的記憶装置に於いて、前記隣接トラック確認部は、前記最長マーク長パターンの試し書きが済んだ媒体のテスト領域の特定トラックの特定セクタ位置を指定して、前記第2テストパターンとして装置動作上の最高パワーを初期値としたDC発光パターンにより規定回数試し書きすることを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項23】請求項1又は2記載の光学的記憶装置に於いて、前記隣接トラック確認部は、装置内温度変化が規定値以上の時に、試し書きして記録パワーを再設定することを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項24】請求項1又は2記載の光学的記憶装置に於いて、前記隣接トラック確認部は、前回の試し書きからの経過時間を監視し、所定の試し書き有効時間経過後に再度試し書きして記録パワーを再設定することを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項25】請求項1又は2記載の光学的記憶装置に於いて、前記隣接トラック確認部は、上位からの指示によって試し書きして記録パワーを再設定することを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項26】請求項1又は2記載の光学的記憶装置に於いて、前記隣接トラック確認部は、試し書きする媒体の位置を毎回変えながら、試し書きにより記録パワーを再設定することを特徴とする光学的記憶装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、MOカートリッジ

等の書き換え可能な媒体を用いた光学的記憶装置に関し、特に、媒体ローディング時にレーザダイオードの発光パワーを効率的に最適パワーに調整する光学的記憶装置に関する。

【0002】

【従来の技術】光ディスクは、近年急速に発展するマルチメディアの中核となる記憶媒体として注目されており、例えば3.5インチのMOカートリッジを見ると、旧来の128MBや230MBに加え、近年にあっては、540MBや640MBといった高密度記録の媒体も提供されつつある。このため、光ディスクドライブとしては、現在入手できる180MB、230MB、540MB及び640MBといった全ての媒体を使用できることが望まれる。

【0003】ところで、光ディスクドライブに使用するMOカートリッジにあっては、媒体トラックをゾーン分割し、ゾーン毎のセクタ数を同一としたZCAV記録（ゾーン定角速度記録）を採用している。MO媒体のゾーン数は、従来の128MB媒体では1ゾーン、230MB媒体では10ゾーンとなっているが、近年実用化された540MBや640MBといった高密度のPWM記録媒体にあっては、記録密度の向上に伴って媒体のトラックピッチが狭くなり、ゾーン数も増加している。

【0004】即ち、640MB媒体は11ゾーンと少ないが、540MB媒体では18ゾーンとなっている。通常、MOカートリッジを使用する光ディスク媒体の場合、媒体毎に最適な記録パワーに相違があることから、媒体をローディングした際に、ゾーン毎に試し書きを行って最適な記録パワーに調整する発光調整を行っている。

【0005】また従来の128MBや230MB媒体は、ビットポジション変調（PPM）による記録であり、発光パワーはイレースパワーと記録パワーの2段階の変化でよい。これに対し540MBや640MBのPWM媒体では、記録密度を高めるためにパルストレインによる記録を採用している。パルストレイン記録では、発光パワーを、イレースパワー、第1ライトパワー、及び第2ライトパワーの3段階に変化させている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、光ディスク媒体の高密度化を実現するためにトラック間ピッチを狭めた場合、隣接トラックに対して熱伝導が起りやすくなるため、レーザダイオードによる試し書きによって最適な記録パワーを決めていても、目的トラックに対する記録は適切にできるが、隣接トラックを消去してしまったり、隣接トラックのデータが漏れ込んでしまう等の問題が発生する可能性が考えられる。

【0007】本発明は、このような問題点を鑑みてなされたもので、記録時の隣接するトラックへの漏れ込みによるデータ破壊を起すことなく最適な記録パワーを設

定できるようにした光学的記憶装置を提供することを目的とする。

【0008】

【課題を解決するための手段】図1は本発明の原理説明図である。本発明の光学的記憶装置は、図1(A)のように、ビーム光を発光するレーザダイオードを有し、隣接トラック確認部205により、所定の発光パワーによるレーザダイオードの発光駆動で、少なくとも隣接する2トラックに第1テストパターンと第2テストパターンを順番に試し書きした後に、先に第1テストパターンを

10 試し書きした隣接トラックを再生してデータ破壊の有無を確認し、データ破壊がなかった場合に試し書きした発光パワーを記録パワーとすることを特徴とする。

【0009】また本発明の変形にあっては、隣接トラック確認部205により、所定の発光パワーによるレーザダイオードの発光駆動で少なくとも隣接する3トラックの中央のトラックに第1テストパターンを、両側の2トラックに第2テストパターンを順番に試し書きした後に、先に第1テストパターンの試し書きした隣接トラックを再生してデータ破壊の有無を確認し、データ破壊が

20 なかった場合に試し書きした発光パワーを記録パワーとしてもよい。

【0010】このような本発明の光学的記憶装置によれば、記録パワーが決定された後に、決定された記録パワーで試し書きを行って隣接トラックのデータ破壊がないことを確認して初めて実際の媒体記録に使用する有効な記録パワーとして設定され、トラック間隔を狭めて高密度化した媒体であっても、設定された記録パワーにより隣接トラックのデータを破壊したり、隣接トラックからのデータの漏れ込みを受けることなく、最適な記録が実

30 現できる。

【0011】隣接トラック確認部205は、図1(B)のように、テストライト領域240を最初に第1テストパターンで試し書きし、次のその中の特定トラックの同一位置242を予め定めた回数だけ第2テストパターンで試し書きした後に、先に第1テストパターンを試し書きした隣接トラック位置244を再生してデータ破壊を確認する。隣接トラック確認部205は、媒体の最内周又は最外周に存在するユーザ未使用領域の一部で試し書きによる隣接トラックのデータ破壊の有無を確認する。

40 したがって、最適パワーを決定する試し書きを行ってもユーザデータは保証される。

【0012】更に、発光ダイオードの発光パワーの調整により最適記録パワーを決定して隣接トラック確認部205の試し書きに使用する記録パワー初期値を決定する記録パワー調整部204を設ける。隣接トラック確認部205は、記録パワー調整部で決定した最適記録パワーそのものを初期値として試し書きしてもよいし、最適記録パワーよりも高めの記録パワーを初期値として試し書きしてもよい。

【0013】記録パワー調整部204は、発光ダイオードの発光パワーを調整して媒体に試し書きしながら最適記録パワーを決定する、即ち、記録パワー調整部204は、レーザダイオードの記録パワーを段階的に徐々に低下させながら所定のテストパターンを媒体に試し書きした後に再生して元のテストパターンと比較してデータの不一致個数を計数し、この不一致個数が所定の閾値を超える記録パワーを下限記録パワーとして検出し、下限記録パワーに所定のオフセットを加算した値を最適記録パワーに決定する。

【0014】隣接トラック確認部205は、隣接トラックの再生確認が正常に終了した場合、テストライト領域240を初期化記録(イレース)する。隣接トラック確認部205は、隣接トラックのデータ破壊の判断としては次のいずれかとする。

①隣接トラックから再生したRF信号のピーク検波信号のレベル変化が規定値以上であることを検出してデータ破壊と判断する。

【0015】②隣接トラックの記録データと再生データを比較し、ビット誤り個数が規定値以上に増加したことを検出してデータ破壊と判断する。

③隣接トラックの再生データに対するECC誤り訂正数が規定値以上に増加したことを検出してデータ破壊と判断する。

隣接トラック確認部205は、試し書きにより隣接トラックのデータ破壊を確認した場合は、所定の記録下限パワーまで徐々にパワーを減少させながら試し書きを繰り返して隣接トラックのデータが破壊されない記録パワーを求める。この場合、隣接トラック確認部205は、媒体上での位置を変えながら2回目以降の試し書きにより隣接トラックのデータ破壊の有無を確認する。

【0016】隣接トラック確認部205は、記録下限パワーまで徐々にパワーを減少させて試し書きを繰り返しても隣接トラックのデータが破壊された場合は、媒体の異なる位置で再度試し書きにより記録パワーを求める処理を最初からやり直す。このとき、隣接トラック確認部は、最適フォーカス点をサーチして自動焦点制御のオフセット値(目標値)を最適化した後にやり直す。

【0017】最適フォーカス点のサーチは次のいずれかとする。

①対物レンズ位置を調整した際に、媒体戻り光から検出されたトラッキングエラー信号が最大となるレンズ位置を与えるオフセット値を最適フォーカス点とする。

②対物レンズ位置を調整した際に、媒体戻り光から検出されたRF再生信号の最大となるレンズ位置を与えるオフセット値を最適フォーカス点とする。

【0018】③対物レンズ位置を調整した際に、媒体戻り光を電気信号に変換する4分割ディテクタの総和信号が最大となるレンズ位置を与えるオフセット値最適フォーカス点とする。

隣接トラック確認部205は、媒体のテストライト領域240の全トラックに、第1テストパターンとして最長マーク長パターンを最初に試し書きする。このテストライト領域240の全トラックに対する最長マーク長パターンの試し書きが済んだら、トラックT1の特定セクタ242を指定して第2テストパターンとして最短マーク長パターンを規定回数試し書きし、その後に隣接セクタ244の最長マーク長記録パターンを再生してデータ破壊の有無を判断する。

【0019】また第2テストパターンとしては、最短マーク長パターンの代わりに装置動作上の最高パワーを初期値としたDC発光パターンを使用して規定回数の試し書きを行い、その後に隣接トラックの最長マーク長記録パターンを再生してデータ破壊の有無を判断してもよい。このような相関の小さい最長マーク長パターンと最短マーク長パターンを隣接した2つのトラックに試し書きすることで、隣接トラックにおけるデータ破壊の有無の確認が少ないデータ量で効率良くできる。

【0020】隣接トラック確認部205による試し書きによる記録パワーの設定タイミングは、次のようにな

る。
①装置温度により媒体の最適記録パワーが変化することから、装置の環境温度変化が規定値以上の時に、試し書きして記録パワーを再設定する。

②装置の使用時間の増加に伴って最適な記録パワーがずれてくる可能性があるため、前回の試し書きからの経過時間を監視し、所定の試し書き有効時間経過後に再度試し書きして記録パワーを再設定する。

【0021】③上位装置からのアクセスに対しオーバタイム等のエラーが発生した場合に対処するため、上位装置からのコマンド指示によって試し書きして記録パワーを再設定する。

更に、隣接トラック確認部205は、①～③のタイミングで記録パワーの調整を実行する際には、試し書きする媒体の位置を毎回変えながら、試し書きにより記録パワーを再設定する。

【0022】

【発明の実施の形態】

<目次>

1. 装置構成
2. 発光調整
3. 最適ライトパワー調整
4. 隣接トラック確認処理

1. 装置構成

図2は本発明の光学的記憶装置である光ディスクドライブの回路ブロック図である。本発明の光ディスクドライブは、コントローラ10とエンクロージャ12で構成される。コントローラ10には光ディスクドライブの全体的な制御を行うMPU14、上位装置との間でコマンド及びデータのやり取りを行なうインタフェースコント

ーラ16、光ディスク媒体へのライトデータのフォーマット処理とリードデータに対するECC処理を行うフォーマッタ18、MPU14、インタフェースコントローラ16及びフォーマッタ18で共用されるバッファメモリ20を備える。

【0023】フォーマッタ18に対してはライト系統としてエンコーダ22とレーザダイオード制御回路24が設けられ、レーザダイオード制御回路24の制御出力はエンクロージャ12側の光学ユニットに設けたレーザダイオードユニット30に与えられている。レーザダイオードユニット30はレーザダイオードとモニタ用の受光素子を一体に備える。

【0024】レーザダイオードユニット30を使用して記録再生を行う光ディスク、即ち書き換え可能なMOカートリッジ媒体として、この実施形態にあつては128MB、230MB、540MB及び640MBのいずれかを使用することができる。このうち128MB及び230MBのMOカートリッジ媒体については、媒体上のマークの有無に対応してデータを記録するビットポジション記録（PPM記録）を採用している。また媒体の記録フォーマットは、ZCAVであり、128MBは1ゾーン、230MBは10ゾーンである。

【0025】一方、高密度記録となる540MB及び640MBのMOカートリッジ媒体については、マークのエッジ即ち前縁と後縁をデータに対応させるパルス幅記録（PWM記録）を採用している。ここで、640MBと540MBの記憶容量の差はセクタ容量の違いによるもので、セクタ容量が2KBのとき640MBとなり、一方、512Bのときは540MBとなる。また媒体の記録フォーマットはZCAVであり、640MBは11ゾーン、540MBは18ゾーンである。

【0026】このように本発明の光ディスクドライブは、128MB、230MB540MBまたは640MBの各記憶容量のMOカートリッジに対応可能である。したがって光ディスクドライブにMOカートリッジをローディングした際には、まず媒体のID部をリードし、そのビット間隔からMPU14において媒体の種別を認識し、種別結果をフォーマッタ18に通知することで、128MBまたは230MB媒体であればPPM記録に対応したフォーマット処理を行い、540MBまたは640MB媒体であればPWM記録に従ったフォーマット処理を行うことになる。

【0027】フォーマッタ18に対するリード系統としては、デコーダ26、リードLSI回路28が設けられる。リードLSI回路28に対しては、エンクロージャ12に設けたディテクタ32によるレーザダイオード30からのビームの戻り光の受光信号が、ヘッドアンプ34を介してID信号及びMO信号として入力されている。

【0028】リードLSI回路28にはAGC回路、フ

フィルタ、セクタマーク検出回路、シンセサイザ及びPLL等の回路機能が設けられ、入力したID信号及びMO信号よりリードクロックとリードデータを作成し、デコーダ26に出力している。またスピンドルモータ40による媒体の記録方式としてゾーンCAVを採用していることから、リードLSI回路28に対してはMPU14より、内蔵したシンセサイザに対しゾーン対応のクロック周波数の切替制御が行われている。

【0029】ここでエンコーダ22の変調方式及びデコーダ26の復調方式は、フォーマット18による媒体種別に応じ、128MB及び230MBについてはPPM記録の変調及び復調方式に切り替えられる。一方、540及び640MBの媒体については、PWM記録の変調及び復調方式に切り替えられる。MPU14に対しては、エンクロージャ12側に設けた温度センサ36の検出信号が与えられている。MPU14は、温度センサ36で検出した装置内部の環境温度に基づき、レーザダイオード制御回路24におけるリード、ライト、イレースの各発光パワーを最適値に制御する。MPU14は、ドライバ38によりエンクロージャ12側に設けたスピンドルモータ40を制御する。

【0030】MOカートリッジの記録フォーマットはZCAVであることから、スピンドルモータ40を例えば3600rpmの一定速度で回転させる。またMPU14は、ドライバ42を介してエンクロージャ12側に設けた電磁石44を制御する。電磁石44は装置内にローディングされたMOカートリッジのビーム照射側と反対側に配置されており、記録時及び消去時に媒体に外部磁界を供給する。

【0031】DSP15は、媒体に対しレーザダイオード30からのビームの位置決めを行うためのサーボ機能を実現する。このため、エンクロージャ12側の光学ユニットに媒体からのビーム戻り光を受光する4分割ディテクタ46を設け、FES検出回路（フォーカスエラー信号検出回路）48が、4分割ディテクタ46の受光出力からフォーカスエラー信号E1を作成してDSP15に入力している。ここで4分割ディテクタ46の受光部46a、46b、46c、46dの受光信号をEa、Eb、Ec、Edとすると、フォーカスエラー信号E1は、
$$E1 = (Ea + Ec) - (Eb + Ed)$$
として検出される。

【0032】このフォーカスエラー信号E1は、DSP15に与えられ、DSP15で実現される自動焦点制御部でフォーカスエラー信号E1を最小とするフォーカスアクチュエータ56のフィードバック制御が行われる。DSP15で実現される自動焦点制御部は、制御ループをオフした状態で対物レンズの位置を順次移動しながら最適フォーカス点となるオフセット値（目標値）求め、この最適フォーカス点のオフセット値を自動焦点制御

ープに設定し、オフセット値で決まる位対物レンズの位置（最適フォーカス点）を基準にフォーカスエラー信号E1を最小とするようにフィードバック制御される。この最適フォーカス点を与えるオフセット値の決めとしては、トラッキングエラー信号E2が最大となるレンズ位置、RF再生信号が最大となるレンズ位置、及び4分割ディテクタ46の総和信号が最大となるレンズ位置の3つがある。

【0033】TES検出回路（トラッキングエラー信号検出回路）50は、4分割ディテクタ46の受光出力からトラッキングエラー信号E2を作成し、DSP15に入力している。即ち、トラッキングエラー信号E2は、4分割ディテクタ46の受光部46a、46b、46c、46dの受光信号をEa、Eb、Ec、Edとすると、
$$E2 = (Ea + Eb) - (Ec + Ed)$$
となる。

トラッキングエラー信号E2はTZC回路（トラックゼロクロス検出回路）45に入力され、トラックゼロクロスパルスE3を作成してDSP15に入力している。

【0034】更にエンクロージャ12側には、媒体に対しレーザビームを照射する対物レンズのレンズ位置を検出するレンズ位置センサ52が設けられ、そのレンズ位置検出信号（LPOS）E4をDSP15に入力している。DSP15は、ビーム位置決めのため、ドライバ54、58、62を介してフォーカスアクチュエータ56、レンズアクチュエータ60及びVCM64を制御駆動している。

【0035】ここで光ディスクドライブにおけるエンクロージャの概略は図3のようになる。図3において、ハウジング66内にはスピンドルモータ40が設けられ、スピンドルモータ40の回転軸のハブに対しインレットドア68側よりMOカートリッジ70を挿入することで、内部のMO媒体72がスピンドルモータ40の回転軸のハブに装着されるローディングが行われる。

【0036】ローディングされたMOカートリッジ70のMO媒体72の下側には、VCM64により媒体トラックを横切る方向に移動自在なキャリッジ76が設けられている。キャリッジ76上には対物レンズ80が搭載され、固定光学系78に設けている半導体レーザからのビームをプリズム82を介して入射し、MO媒体72の媒体面にビームスポットを結像している。

【0037】対物レンズ80は図2のエンクロージャ12に示したフォーカスアクチュエータ56により光軸方向に移動制御され、またレンズアクチュエータ60により媒体トラックを横切る半径方向に例えば数十トラックの範囲内で移動することができる。このキャリッジ76に搭載している対物レンズ80の位置が、図2のレンズ位置センサ52により検出される。レンズ位置センサ52は対物レンズ80の光軸が直上に向かう中立位置でレ

を試し書き：

②テストライト領域の特定トラックの特定セクタ位置に第2テストパターンを規定回数回数例書き；

③第2テストパターンを試し書きしたセクタの隣接セクタを再生してデータ破壊の有無を確認：とする。また隣接トラック確認処理が正常に終了したら、テストライト領域を初期化記録（イレース）しておく。

【0066】隣接トラック確認部205による隣接トラックのデータ破壊の判断としては、再生したRF信号のピーク検波信号のレベル変化が規定値以上であること、再生データを元の記録データ比較しテビット誤り個数が規定値以上に増加したこと、或いは、再生データに対するECC誤り訂正数が規定値以上に増加したことを検出してデータ破壊と判断する。

【0067】更に、隣接トラック確認部205は、試し書きにより隣接トラックのデータ破壊を確認した場合は、発光パワー調整部204での試し書きで求めた記録下限パワーまで徐々にパワーを減少させて試し書きを繰り返しながら隣接トラックのデータが破壊されない記録パワーを求める。この場合、媒体上での確認位置を変えながら2回目以降の試し書きにより隣接トラックのデータ破壊の有無を確認する。

【0068】隣接トラック確認部205は、記録下限パワーまで徐々にパワーを減少させて試し書きを繰り返しても隣接トラックのデータが破壊された場合は、媒体の異なる位置で再度試し書きにより記録パワーを求める処理を最初からやり直す。このとき、隣接トラック確認部205は最適フォーカス点検出部207を起動し、最適フォーカス点をサーチして自動焦点制御の目標値を与えるオフセット値を最適化した後にやり直す。

【0069】隣接トラック確認部205の試し書きに使用する第1テストパターンとしては例えば最長マーク長パターンを使用し、第2テストパターンとして最長マーク長パターンに対し相関の小さい最短マーク長パターンを使用し、これによって隣接トラックでのデータ破壊の有無の確認が少ないデータ量で効率良くできるようにする。また第2テストパターンとしては、装置動作上の最高パワーを初期値としたDC発光パターンを使用してもよい。

【0070】次に、図7の発光パワー調整部200による最適ライトパワーを決定するための調整処理の詳細をフローチャートを参照して説明する。図11は本発明の光ディスクドライブに媒体をローディングした際のディスク起動処理である。本発明の光ディスクドライブとして使用する媒体には、PPM記録媒体である128MB媒体と230MB媒体、及びPWM記録媒体である540MB媒体と640MB媒体の4種類がある。図11において、ステップS1で媒体のロードを行って、図3に示したようにスピンドルモータ40にセットして一定速度で回転する。

【0071】続いてステップS2で、発光調整要求フラグFLをセットする。更にステップS3で現在時刻を初期化し、ステップS4で現在の装置内温度Tを検出して、起動時の記録パワーの調整に必要な処理を終了する。またディスク起動処理にあっては、この記録パワー決定のための準備処理以外に、図7に示したLD発光処理部160の機能によるレーザダイオード制御回路に設けている電流指示用のDACの各係数テーブルの作成、及び発光パワーのデフォルト値を格納するパワーテーブルの作成が行われ、結果として図8、図9及び図10に示したデフォルトイレースパワーテーブル212、デフォルトライトパワーテーブル214及び温度補正係数テーブル216が準備されることになる。

【0072】図12は光ディスクドライブ起動後の発光パワー調整処理のフローチャートである。この発光パワー調整処理にあっては、ステップS1で上位装置からの発光調整要求の有無をチェックしており、もし要求があればステップS4に進んでテストライトによる調整処理を実行する。通常時にあっては上位装置からの発光調整の要求はないことから、ステップS2に進み、調整の必要性を判断する。

【0073】この発光調整の必要性の判断は、図7の調整タイミング判定部202が行っている。ステップS3で発光調整の必要性が判断されると、ステップS4に進み、発光パワー調整部204が試し書きを実行してライトパワー及びイレースパワーを決定する。次にステップS5に進み、ステップS4で決定したライトパワーとイレースパワーを使用した試し書きにより、隣接トラックのデータ破壊の有無を確認する処理を行い、隣接トラックにデータ破壊を起さない最適なライトパワーとイレースパワーを求める。

【0074】続いてステップS6で現在時刻を更新し、発光調整と隣接トラック確認により最適記録パワーが決定された時刻を保持する。次にステップS7で現在温度を更新し、最適記録パワーが決定されたときの装置内温度を保持する。図13は図12のステップS3における発光調整の必要性判断処理のフローチャートである。発光調整の必要性判断処理にあっては、まずステップS1で現在時刻を読み込み、ステップS2で光ディスクドライブの起動から前回の発光調整までの時間Aを算出する。ステップS3では、起動からの時間Aを予め定めた一定時間例えば20秒で割ることで、単位時間数Bに変換する。

【0075】ステップS4にあっては、単位時間数Bが8未満、即ち起動から最初のテストライトまでの時間Aが160秒未満か否かチェックする。160秒未満であればステップS5に進み、単位時間数Bは4未満か、即ち時間Aは80秒未満か否かチェックする。時間Aが80秒から160秒の間であった場合には、ステップS6で単位時間数Bを3、即ち時間Aを30秒にクリップし

て、ステップS7に進む。ステップS5で時間Aが80秒未満であった場合には、そのままステップS7に進む。ステップS7では、前回の発光調整で決定されている最適記録パワーの使用を保证する有効時間Cを算出する。

【0076】この場合、有効時間Cは20秒×2ⁿ（単位時間数）とする。但し、有効時間の最大値は160秒にリミットされる。この結果、発光調整で決定された最適記録パワーを保证する有効時間Cは、起動から最初の発光調整までの時間Aが160秒未満であれば2ⁿに対応した時間に設定される。160秒を超えた場合には、一定の有効時間C=160秒に固定される。

【0077】このような有効時間Cの算出は、光ディスクドライブにローディングした媒体の媒体温度が装置内温度に安定するまでに掛かる時間に応じて可変させている。即ち、媒体をローディングした直後の初期段階にあっては、媒体と装置内の温度の間には差があることから、この段階では装置内温度に基づいた記録パワーの調整は有効にできないことから、起動時には記録パワーの調整は行わない。

【0078】ローディングした媒体の温度は1〜2分程度経過すると装置内の温度に平衡してくる。そこで光ディスクドライブ起動後の最初に上位装置からライトコマンドが発行されたタイミングに同期して最初の発光パワー調整を行う。起動後、上位装置からライトコマンドが発行されるタイミングは様々であることから、図41のステップS1〜S7において、起動から最初の発光調整までの時間Aを求め、この時間Aから次回以降の発光調整タイミング判別のための有効時間Cを決めるようにしている。

【0079】ステップS7で有効時間Cが算出できたならば、ステップS8で、有効判定時刻Dを前回のテストライト時刻に算出した有効時間Cを加えた時刻として算出する。そしてステップS9で、現在時刻が有効判定時刻Dを超えたか否かを判定する。現在時刻が有効判定時刻Dを超えていれば、ステップS14に進んでテスト発光調整フラグをオンし、図12のステップS3にリターンする。

【0080】ステップS9で現在時刻が有効判定時刻Dに達していない場合には、ステップS17で発光調整フラグをオフとする。またステップS4で単位時間Bが8以上即ち160秒以上の場合には、ステップS10に進み、現在時刻から前回の発光調整時刻を引いた時間が1時間未満か否かをチェックする。1時間未満であればステップS11で現在温度を読み込み、ステップS12で前回温度に対し現在温度が±3℃の範囲内か否かをチェックする。3℃以内であれば、ステップS13で発光調整フラグをオフし、発光調整は行わない。

【0081】前回温度に対し±3℃の範囲を超える温度変動があった場合には、ステップS14で発光調整フラ

グをオンし、発光調整を実行する。またステップS10で現在時刻と前回の発光調整時刻との差が1時間以上の場合には、ステップS14で強制的に発光調整フラグをオンして発光調整を実行する。なお、この発光調整必要性判断処理で整定されている各閾値時間は必要に応じて適宜に定めることができる。

【0082】図14は図40のステップS4で行う試し書きを伴う発光調整処理であり、図35の発光調整部204により行われる。まずステップS1で装置内温度Tを測定する。続いてステップS2で、図2のコントローラ10に設けているバッファメモリ20上にライトパターン「596595」と「FEDC...3210」の各16進のテストパターンを生成する。テストパターン「596595」はエラー発生が最も大きいことが予想される最悪パターンであり、「FEDC...3210」は16進の各ワードの全パターンである。

【0083】続いてステップS3に進み、試し書きを行うテストライト実行セクタを生成する。テストライト実行セクタは、後の説明で明らかにするように、媒体の非ユーザ領域に定めたテスト領域を指定してセクタアドレスを発生する。次にステップS4で、装置内温度からスタートライトパワーWPのデフォルト比WPOを計算する。次にステップS5で、デフォルトライトパワー比WPOにそのときのデフォルトライトパワーDWPを掛け合わせることでライトパワーWPを計算する。

【0084】次にステップS6で、デフォルト比WPOを用いてイレースパワーEPを計算する。デフォルトイレースパワーEPの計算は、ライトパワーのデフォルト比WPOから1.0を引いた値に係数0.7を掛けた値を1に足したイレースパワーのデフォルト比を用いて、これをデフォルトイレースパワーDEPに掛け合わせることで、イレースパワーEPを計算する。即ち、ライトパワーに対しイレースパワーの変動比を抑えるようにしている。

【0085】次にステップS7で、算出されたライトパワーWPとイレースパワーEPを使用して、ステップS2でバッファメモリに生成された2種のライトパターンの媒体のテスト領域に対する試し書きのデータライトを行う。このとき媒体が128MB媒体または230MB媒体であればPPM記録を行い、540MB媒体または640MB媒体であればPWM記録を行う。

【0086】試し書きのデータライトが済んだならば、ステップS8でテストパターンのデータリードを行い、ステップS9でリードパターンをバッファメモリの元のライトパターンと比較し、データ不一致をワード単位に計数する。ステップS10でデータ不一致数が1000未満であれば、ライト低パワー限界点に達していないことからステップS11に進み、ライトパワーのデフォルト比WPOを所定値0.05減少させ、再びステップS5に戻り、0.05だけ減らしたデフォルト比WPOを

用いた発光調整を行う。

【0087】このようなライトパワーのデフォルト比WPOを低下させながら試し書きのデータライトを繰り返し、ステップS10でデータ不一致数が1000以上になるとライトパワーが下方の限界点に達したものと判定し、ステップS12で25℃の下限パワーのデフォルト比(WPO-EDG)に校正する。即ち、現在温度から25℃を差し引いた値に温度補正係数を乗じた値をステップS10で判定したライトパワー下限(WPO-EDG)に加えて校正する。次にステップS13で、この温度校正值に所定のオフセット比 ΔWPO を加算して最適

パワーのデフォルト比率WPOを算出し、ステップS14で、決定された最適ライトパワーのデフォルト比WPOに基づいた各ゾーンのライトパワーの設定を行う。

【0088】図15は図14における発光調整における発光パワーを段階的に低下させたときのデータ不一致数である。まずスタート点228のデフォルトライトパワーDWPの設定により発光調整を開始し、スタートデフォルト比1.0から0.05ずつ減らしながら発光調整を行って不一致数を求める。ライトパワーWPが下限ライトパワーWPに近付くと不一致数は増加し、予め定めた閾値例えば1000回に達したときに下限230として検出する。そして、このときの下限330における下限ライトパワーWPに対応したデフォルト比WPO-limitに対し所定のオフセット比 ΔWPO を加えることで、最適ライトパワーWPを与えるデフォルト比WPO-bestを決定する。

【0089】図16は、図14のステップS13で限界パワーのデフォルト比に加算するオフセット比 ΔWPO の温度Tに対する温度補正係数 K_t を示している。図16の温度Tに対するオフセット比 ΔWPO を補正するための温度補正係数 K_t は、温度 $T=25^\circ\text{C}$ の補正係数 $K_t=1.0$ とした直線近似の関係式 $K_t=A \cdot T+B$ の係数である傾きAとy軸交点Bにより定められている。

【0090】そこで、そのときの装置内温度Tを関係式に代入することで、対応する温度係数 K_t の値を求め、これに温度 $T=25^\circ\text{C}$ で求めているデフォルトオフセット比 ΔWPO を掛け合わせることで、最適ライトパワーの算出に使用するオフセット比 ΔWPO を求めることができる。図17は、図14のステップS13で使用するオフセット比 ΔWPO のゾーン番号に対するゾーン補正係数 K_i の直線近似の関係式である。この関係式は $K_i=C \cdot i+D$ で決まり、その係数として傾きCとy軸交点Dが準備されている。またゾーン補正係数 K_i は中央のゾーン番号 $i=6$ で1.0としていることから、ゾーン番号6におけるデフォルトオフセット比 ΔWPO が準備されている。

【0091】このため、任意のゾーン番号 i に対し関係式 $K_i=C \cdot i+D$ からゾーン補正係数 K_i を求め、ゾーン番号 i のデフォルトオフセット比 ΔWPO に掛け合

わせることで、ステップS13の最適ライトパワーの算出に使用するオフセット比 ΔWPO を求めることができる。図18は、媒体72の領域であり、本発明の発光調整の際の試し書きに使用するテストライト領域として、ユーザ領域234に対するインナ側の非ユーザ領域236またはアウト側の非ユーザ領域238をパワー調整領域に割り当てる。

【0092】図19(A)(B)は、図18のアウト側の非ユーザ領域238であり、非ユーザ領域238の中の所定トラックT1、T2、T3...の範囲についてテストライト領域240を設定している。このため図14のステップS1にあっては、このテストライト領域240の任意のトラックアドレスとセクタ番号を指定して試し書きを行うセクタを指定することになる。

【0093】テストライトを行うセクタ指定の方法は、特定のセクタにテストライトが集中することを選けるため、乱数を使用してランダムテストセクタを指定するか、或いは所定の順番にテストセクタを指定する。また発光調整が済んだら、試し書きを行ったテストセクタは、イレースにより初期化記録しておく。この試し書きを行う媒体のテスト領域については、発光調整により記録パワーを求めた後に行なう隣接トラック確認の際にも同様にして使用される。4. 隣接トラック確認処理

図20は図12のステップS5における試し書き(テストライト)を伴う隣接トラック確認処理のフローチャートである。まず隣接トラック確認処理に先立ち、ステップS1で、図7の隣接トラック確認部205に設けている最適フォーカス点検出部207によって最適フォーカス点を与えるオフセット値をサーチして自動焦点制御ループに設定する。

【0094】この最適フォーカス点検出部207の機能は、図2のコントローラ10に設けているDSP15により実行される。即ちDSP15は、自動焦点制御ループをオフした状態でフォーカスアクチュエータ56に対してドライバ54を介してフォーカスオフセットの値を段階的に増加させながら、そのときのトラッキングエラー信号E1またはディテクタ32から検出されるRF再生信号から最適フォーカス点を与えるオフセット値を判定する。具体的には、次の3つのいずれかとする。

【0095】①トラッキングエラー信号E2が最大となるオフセット値を最適フォーカス点とする。

②ディテクタ32からヘッドアンプ34を介して得られたMO信号またはID信号のいずれかのRF再生信号の振幅が最大となるオフセット値を最適フォーカス点とする。

【0096】③4分割ディテクタ46の総和信号($E_a+E_b+E_c+E_d$)が最大となるオフセット値を最適フォーカス点とする。

このようにステップS1で最適フォーカス点をサーチして求めたオフセット値を自動焦点制御ループにセットし

て自動焦点制御を行うことで、媒体に対するビームスポットを最適とした状態で隣接トラック確認処理に入る。

【0097】ステップS2では、図18の媒体72の非ユーザ領域、例えば再アウト側の非ユーザ領域238の中に例えば図19(A)のようにライトテスト領域240を設定し、テストライト領域240の中の例えば全てのトラックT1、T2、・・・に、斜線のようにセクタ単位に第1テストパターンを、そのとき設定されているライトパワー及びイレースパワーを含む記録パワーによるレーザダイオードの駆動で書き込む。このときの第1テストパターンは例えば最長マーク長パターンを使用する。

【0098】続いてステップS3で、確認対象トラックT1の隣接トラックT2に書き込んだ第1テストパターンをリードして再生信号を確認する。続いてステップS4で、確認対象トラックT1の特定のセクタ例えばセクタ242-1を指定して、現在の記録パワーによるレーザダイオードの発光駆動により、隣接トラックT2のセクタ244-1の再生データの破壊の有無を確認するために、第2テストパターンを予め定めた規定回数書きする。このときの第2テストパターンは例えば最短マーク長パターンを使用する。

【0099】続いてステップS5で、第2テストパターンの規定回数のライトが行われたトラックT1のセクタ242-1に隣接する隣接トラックT2のセクタ244-1をリードして、再生信号からデータ破壊があるか否かを判断する。このステップS5における再生信号のデータ破壊の判断は、次の3つのいずれかとする。

①再生したRF信号のピーク検波信号のレベル変化が規定値未満であればデータ破壊がないと判断し、レベル変化が規定値以上であることを検出するとデータ破壊と判断する。

【0100】②記録データと再生データをビット単位に比較し、ビット誤り個数が規定値未満であればデータ破壊はないと判断し、規定値以上に増加していたことを検出した場合にはデータ破壊と判断する。

③再生データに対する図2のコントローラ10に設けているフォーマッタ118のECC回路におけるECC誤り訂正数が、例えば訂正可能な規定値未満であればデータ破壊はないと判断し、規定値以上であればデータ破壊と判断する。

【0101】このようなステップS5における隣接トラックの再生信号の状態からデータ破壊の有無を判断し、ステップS6で隣接トラックのデータ破壊がなかった場合には、図19(A)のテストライト領域240の全トラックをイレースする初期化記録を行った後、ステップS8で、このときの試し書きにより確認できた記録パワーに基づく最適パワーの設定を行う。

【0102】一方、ステップS6で隣接トラックの再生データの破壊が判断された場合には、ステップS9に進

み、図15に示した発光調整の際に求めたパワー下限230以下か否かチェックする。下限パワーより大きければステップS10に戻って、記録パワーを予め定めた所定比率 α 分だけ減少させた後、確認セクタの位置を例えば図19(A)のセクタ242-2に変更し、ステップS4に戻る。

【0103】そして、変更した確認セクタ242-2に対し、ステップS10で変更した記録パワーによるレーザダイオードの発光駆動により第2テストパターンを規定回数試し書きし、ステップS5、S6により隣接トラックT2の隣接セクタ244-2をリードして再生信号のデータ破壊を判断する。そして、隣接トラックの再生信号のデータ破壊が解消されない場合には、ステップS9で記録パワーWPを下限パワー以下となるまで減少させながら、同じ処理を繰り返す。

【0104】媒体欠陥や特別な異常がなければ、通常はステップS10で記録パワーを所定比率 α ずつ減少させながら書込対象トラックの確認セクタに対する第2テストパターンの規定回数の試し書きと隣接トラックのセクタ再生信号の確認を繰り返すと、再生信号のデータが破壊されない記録パワーが求まり、ステップS7でテストライト領域240を初期化記録した後、ステップS8で隣接トラックの再生信号のデータ破壊を起こさなかった記録パワーに基づく最適パワーの設定ができる。

【0105】しかしながら、ステップS9で記録パワーを下限パワー以下としても隣接トラックのセクタ再生信号にデータ破壊が起きていた場合には、ステップS12で、ステップS1と同様最適フォーカス点のサーチによりオフセット値を再設定し直した後、ステップS13で実行回数が規定値に達するまで、ステップS2に戻って最初から隣接トラック確認処理を繰り返す。ステップS2からの隣接トラック確認処理の実行回数が規定値に達するまで隣接トラック確認処理を繰り返しても、隣接トラックのデータ破壊が解消できなかった場合には、ステップS13からステップS14に進み、この場合は異常終了とする。

【0106】図19(A)は、テストライト領域240の隣接する2トラック、例えばトラックT1、T2を対象とした第1テストパターンと第2テストパターンの試し書きで再生信号のデータ破壊を起こさなかった記録パワーに基づく最適パワーの設定を行っているが、図19(B)のように、テスト領域の中の3トラック、例えばトラックT1～T3を指定した試し書きによって再生信号のデータ破壊を起こさなかった記録パワーに基づく最適パワーの設定を行ってもよい。

【0107】即ち、図19(B)にあっては、所定のイレースパワーとライトパワーを含む記録パワーによるレーザダイオードの発光駆動で少なくとも隣接する3トラックT1、T2、T3の中央のトラックT2に第1テストパターンを試し書きし、続いて両側の2トラックT

10

20

30

40

50

1, T3に第2テストパターンを順番に試し書きした後、先に第1テストパターンの試し書きした隣接トラックT2を再生してデータ破壊の有無を確認し、データ破壊がなかった場合に試し書きした記録パワーを最適な記録パワーとする。

【0108】勿論、図19(B)についても、図19(A)と同様、隣接する3トラックT1, T2, T3の全てに第1テストパターンを試し書きし、続いて両側の2トラックT1, T3の特定セクタに第2テストパターンを順番に試し書きした後に、第2テストパターンの書き込みセクタに隣接する先に第1テストパターンを試し書きした隣接トラックT2のセクタを再生してデータ破壊の有無を確認し、データ破壊がなかった場合に試し書きした記録パワーを最適な記録パワーとしてもよい。

【0109】図21は図20の隣接トラック確認処理で使用するテストパターン及びその発光パワーのタイムチャートである。図21(A)～(E)は、最初にテスト領域240の全域に試し書きする第1テストパターンのライトデータ、PWMデータ、第1ライトパルス、第2ライトパルス及び発光パワーを表しており、図21(B)のPWMデータから明らかなように、最長マーク長パターンとしている。

【0110】この最長マーク長パターンは、ライトデータとしてのビットパターンで見ると「1111・・・・110」となる。図21(B)のPWMデータは、図21(C)の第1ライトパルスが1つと、その後ろに図21(D)の第2ライトパルスが最長マーク長にに応じた数だけ並び、図21(E)のような発光パワーによってテストライト領域240の全トラックに最初に試し書きされる。

【0111】図21(F)～(J)は、確認対象トラックの特定セクタに規定回数試し書きする第2テストパターンのライトデータ、PWMデータ、第1ライトパルス、第2ライトパルス及び発光パワーであり、図21(G)のPWMデータから明らかなように、最短マーク長パターンとしている。即ち、PWMデータは1パターン長の先頭位置に1ビット幅の最短マークを持っており、図21(F)のライトデータのビットパターンで表すと「10000・・・・0」となる。

【0112】この最短マーク長パターンのPWMデータの書き込みについては、図21(H)の第1ライトパルスが1つ生成され、図21(I)の第2ライトパルスは出されず、その結果、図21(J)の発光パワーのように、基本的には(E P + P R)のイレースパワーであり、途中で第1ライトパルスに対応した最短マーク長に対応するライトパワーWP1だけアップした部分をもっている。

【0113】また図21(F)～(J)の第2テストパターンとしての最短マーク長パターンにビットパターンとして「1000・・・・0」を使用しているが、マーク長

が0となるオール0のビットパターンとしてもよい。このオール0のビットパターンにあつては、確認対象トラックに対する発光パワーは(E P + P R)のイレースパワーによるDC発光パターンであり、装置の動作上、最高となるイレースパワーを初期値としたDC発光パターンを使用する。

【0114】このイレースパワーのDC発光パターンを第2テストパターンとした場合についても、隣接トラックの再生データにデータ破壊があつたときには、ステップS10でイレースパワーを規定比率 α ずつ減らしながら再生信号のデータ破壊のないイレースパワーEPを求め、ステップS8で、求めたイレースパワーEPに対する他の第1ライトパワー、第2ライトパワーの設定を行う。

【0115】また図19ではライトテスト領域240の全域に第1テストパターンとして最長マーク長パターンを最初に試し書きしているが、隣接トラックの確認処理には、少なくとも2本の隣接したトラックに第1テストパターンを試し書きし、その後一方のトラックの特定セクタを確認セクタに指定して第2テストパターンを規定回数試し書きして隣接セクタのデータ破壊を確認してもよい。

【0116】更に、ライトテスト領域240の全域に逆に最短マーク長パターンを第1テストパターンとして最初に試し書きし、その後特定トラックの特定セクタを確認セクタに指定して最長マーク長パターンを第2テストパターンとして規定回数試し書きして隣接セクタのデータ破壊を確認してもよい。更にまた、図21はPWM記録による試し書きを例にとっているが、図6のPPM記録についても、同様に最長マーク長パターンと最短マーク長パターンを第1及び第2テストパターンとして使用した試し書きにより、隣接トラックのデータ破壊の有無の確認を起してもよい。

【0117】図22は、試し書きによる隣接トラックの確認処理が済んだ後に図20のステップS8で最終的に行われる記録パワー設定処理、即ちパワーテーブル作成処理のフローチャートである。パワーテーブル作成処理にあつては、ステップS1でゾーンごとのイレースパワーEP、第1ライトパワーWP1のデフォルトパワーテーブルを装置内温度から計算する。

【0118】続いてステップS2でゾーン番号iのライトパワー(WP)iを設定し、ライトパワー調整に求めた最適デフォルト比WPOをデフォルトライトパワーDWPiに掛け合わせ、更に温度補正を行ってライトパワーを算出する。次にステップS3で、PWM媒体が否かチェックする。もしPWM媒体であつた場合にはステップS4に進み、ゾーン番号iのパワー比(WP2/WP1)にステップS2で求めた第1ライトパワーに相当するライトパワー(WP1)iを乗じ、第2ライトパワー(WP2)iを算出する。最終的にステップS5で、ゾ

ーン番号*i*のイレースパワー(EP)*i*を設定する。

【0119】このイレースパワーの算出にあつては、ライトパワー調整で得られた最適ライトパワーのデフォルト比WPOから1.0を引いた値に変動分を抑えるための係数0.7を乗じ、これを1.0に加えてデフォルトイレースパワーDP*i*に掛け合わせる。もちろん、そのときの測定温度による温度補正を施す。このような図22のパワーテーブル作成処理により、図7のパワーテーブル格納部210に示したイレースパワーテーブル218、第1ライトパワーテーブル220及び第2ライトパ

ワーテーブル222が作成されることになる。
【0120】そして、それ以降の上位装置からのライトアクセスに対しゾーン番号に対応したパワーを読み出し、そのときの装置内温度に従った温度補正を施した後、図4のレーザダイオード制御回路のレジスタに対するDAC指示値を算出してセットし、レーザダイオード100の発光制御を行うことになる。

【0121】

【発明の効果】以上説明してきたように本発明によれば、媒体の非ユーザ領域に第1テストパターンを試し書きした後、試し書きで使用した記録パワーもしくはそれより高いパワーにより所定トラックの同一位置に第2テストパターンを規定回数試し書きしてその隣接トラック位置の再生信号からデータ破壊の有無を判断し、データ破壊がなければ適正な記録パワーとして設定し、データ破壊があった場合には記録パワーを下げながら試し書きを行って、隣接トラックにデータ破壊を起こさない適切な記録パワーを設定することができ、媒体のトラック間隔が狭まって高密度化した際の記録パワーの調整を最適化して、隣接トラックのデータを破壊することなく最適な記録を実現することができる。

【0122】また隣接トラックのデータ破壊を試し書きにより判断する際に最適フォーカス点のサーチを取り込むことで、フォーカス点がずれてビームが太くなっていることによる隣接トラックのデータ破壊を最適パワーの設定から区別し、記録パワーの強さによる隣接トラックのデータ破壊の有無の正確な判断ができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の原理説明図

【図2】本発明による光ディスクドライブのブロック図

【図3】MOカートリッジをローディングした装置内部構造の説明図

【図4】図2のレーザダイオード制御回路のブロック図

【図5】本発明のPWM記録における信号、発光電流、差引電流及びモニタ電流のタイムチャート

【図6】本発明のPPM記録における信号、発光電流、差引電流及びモニタ電流のタイムチャート

【図7】図2のMPUで実現される最適ライトパワー調整部の機能ブロック図

【図8】図7のデフォルトイレースパワーテーブルの説

明図

【図9】図7のデフォルトライトパワーテーブルの説明図

【図10】図7の温度補正係数テーブルの説明図

【図11】図7の発光パワー調整に先立つディスク起動処理のフローチャート

【図12】図7の隣接トラック確認を含む記録パワー調整処理のフローチャート

【図13】図7の記録パワー調整の必要性判断のフローチャート

【図14】試し書きによる図7の記録パワー調整処理のフローチャート

【図15】図14における限界パワーの検出と最適パワーの設定の説明図

【図16】図14の限界パワーに加算して最適パワーを求めるオフセット比の温度を補正する温度補正係数の説明図

【図17】図14の限界パワーに加算して最適パワーを求めるオフセット比のゾーン位置に対する補正係数の説明図

【図18】媒体の領域説明図

【図19】図18の非ユーザ領域に割り当てられたテストライト領域の説明図

【図20】図7の隣接トラック確認処理のフローチャート

【図21】隣接トラック確認処理で使用する第1及び第2テストパターンのタイムチャート

【図22】最適ライトパワーの調整結果を用いたパワーテーブル設定処理のフローチャート

【符号の説明】

10:コントローラ

12:エンクロージャ

14:MPU

15:DSP

16:インタフェースコントローラ

18:フォーマッタ

20:バッファメモリ

22:エンコーダ

24:レーザダイオード制御回路

26:デコーダ

28:リードLSI回路

30:レーザダイオードユニット

32:ディテクタ

34:ヘッドアンプ

36:温度センサ

38, 42, 54, 58, 62:ドライバ

40:スピンドルモータ

44:電磁石

46:4分割ディテクタ

48:FES検出回路

50:TES検出回路
 52:レンズ位置センサ
 56:フォーカスアクチュエータ
 60:レンズアクチュエータ
 64:VCM(キャリッジアクチュエータ)
 66:ハウジング
 68:インレットドア
 70:MOカートリッジ
 72:MO媒体
 76:キャリッジ
 78:固定光学系
 80:対物レンズ
 100:レーザダイオード(LD)
 102:モニタフォトダイオード(PD)
 104:リードパワー電流源
 106:イレースパワー電流源
 108:第1ライトパワー電流源
 110:第2ライトパワー電流源
 112:イレースパワー差引電流源
 114:第1ライトパワー差引電流源
 116:第2ライトパワー差引電流源
 118:モニタ電圧検出抵抗
 120:目標DAレジスタ(目標DACレジスタ)
 122:イレースパワー電流レジスタ(EP電流DAC
 レジスタ)
 124:第1ライトパワー電流レジスタ(WP1電流D
 ACレジスタ)
 126:第2ライトパワー電流レジスタ(WP2電流D
 ACレジスタ)
 128:イレースパワー差引DAレジスタ(EP差引D
 ACレジスタ)
 130:第1ライトパワー差引DAレジスタ(WP1差*

*引DACレジスタ)
 132:第2ライトパワー差引DAレジスタ(WP2差
 引DACレジスタ)
 134:モニタADCレジスタ
 136,140,142,144,146,148,150:DAコンバータ(DA
 C)
 138:自動パワー制御部(APC)
 152:ADコンバータ(ADC)
 200:パワー調整部
 202:調整タイミング判定部
 204:発光パワー調整部
 205:隣接トラック確認部
 206:パワーテーブル作成部
 207:最適フォーカス点検出部
 210:パワーテーブル格納部
 212:デフォルトイレースパワーテーブル
 214:デフォルトライトパワーテーブル
 216:温度補正係数テーブル
 218:イレースパワーテーブル
 220:第1ライトパワーテーブル
 222:第2ライトパワーテーブル
 224:パワー設定処理部
 226:レジスタ群
 228:開始点
 230:限界点
 232:最適点
 234:ユーザ領域
 236,238:非ユーザ領域
 240:テストライト領域
 242-1,242-2:確認セクタ位置
 244-1,244-2:隣接セクタ位置

【図3】

【図8】

MOカートリッジをローディングした装置内部構造の説明図

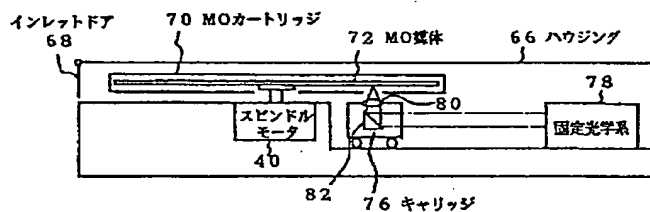


図7のデフォルトイレースパワーテーブルの説明図

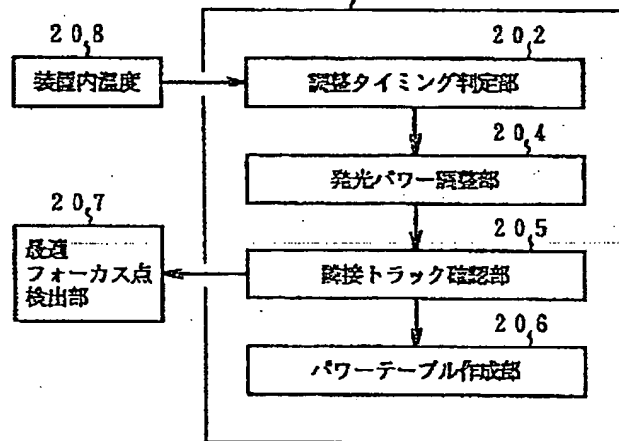
ゾーン番号	DEP1
1	3.0mW
2	3.2mW
3	3.3mW
4	3.4mW
5	3.7mW
6	3.8mW
7	3.9mW
8	4.1mW
9	4.2mW
10	4.4mW
11	4.5mW

【図1】

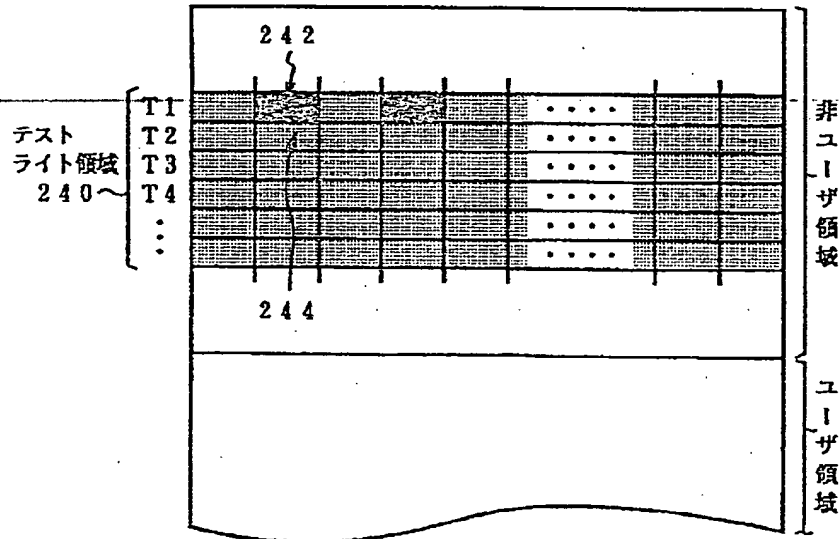
本発明の原理説明図

(A)

200 発光調整部

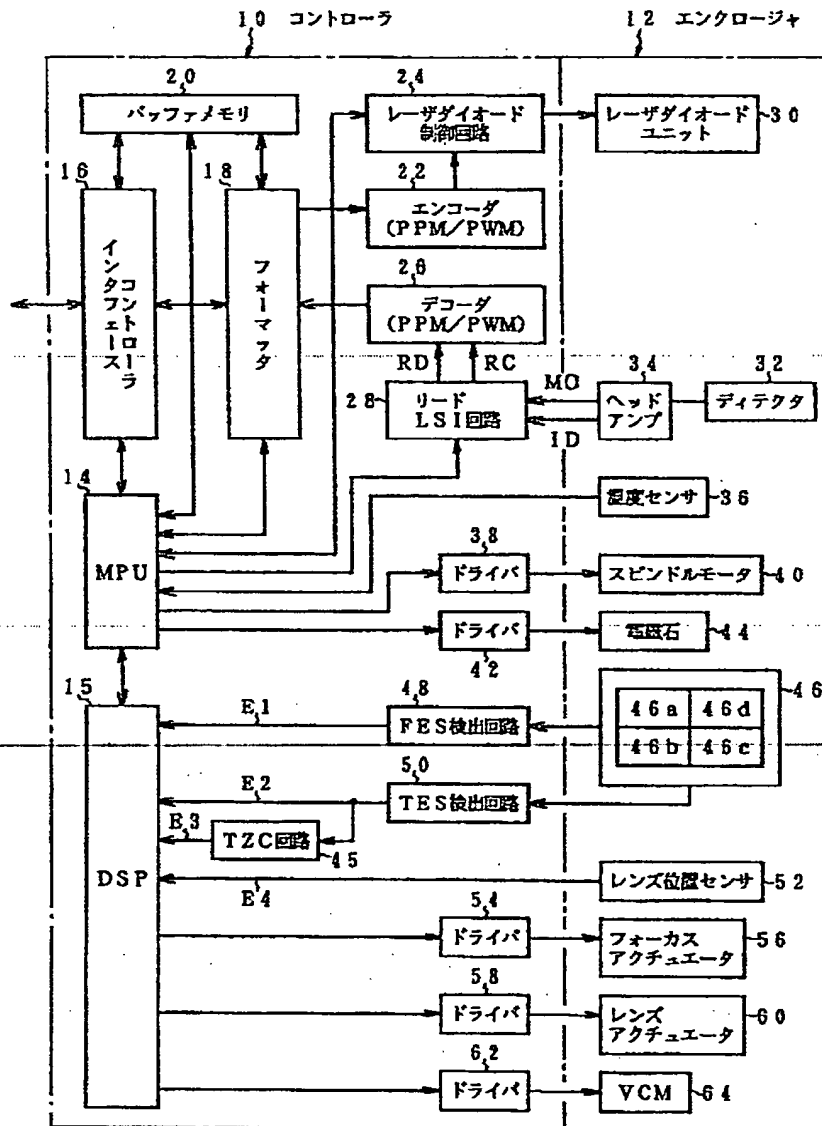


(B)



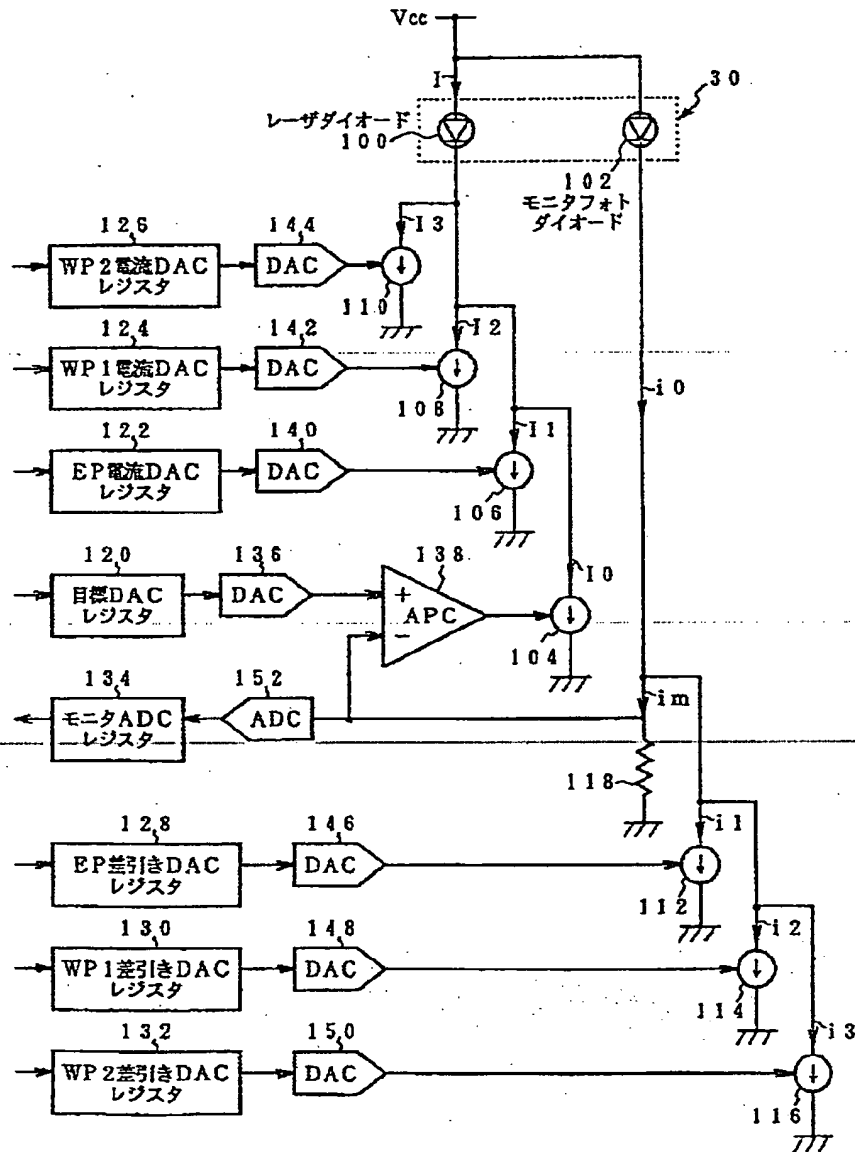
【図2】

本発明による光ディスクドライブのブロック図



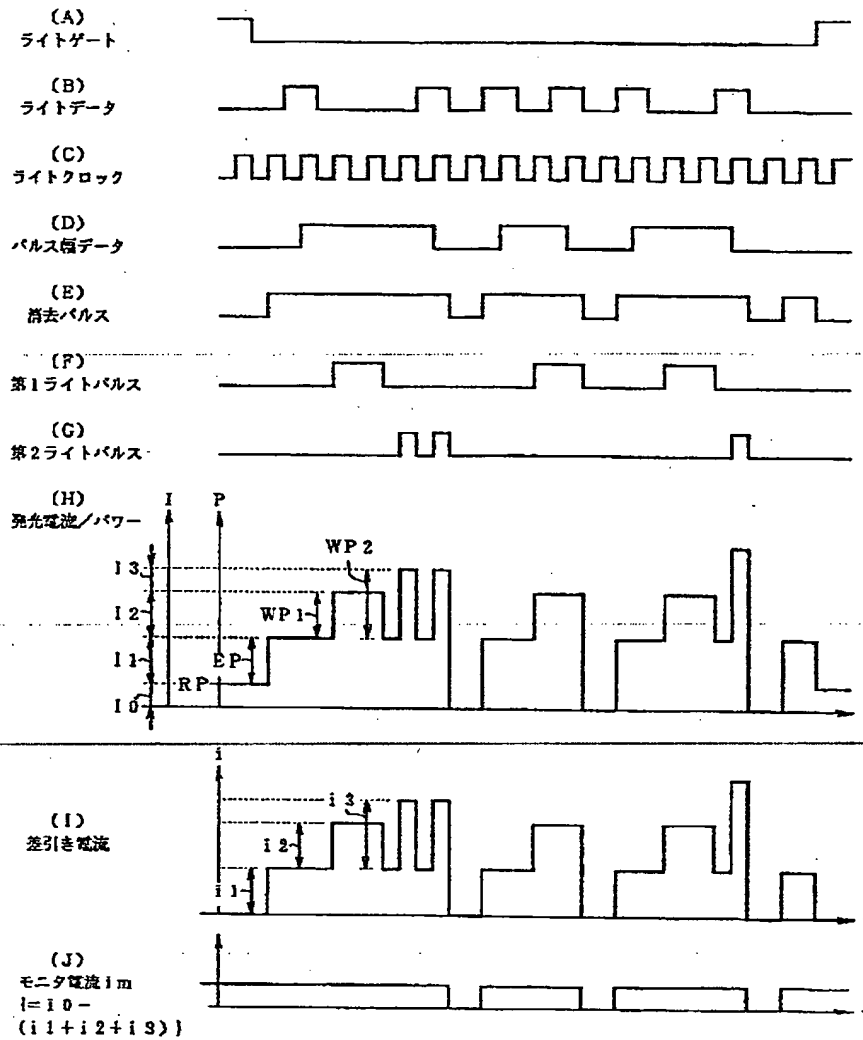
【図4】

図2のレーザダイオード制御回路のブロック図



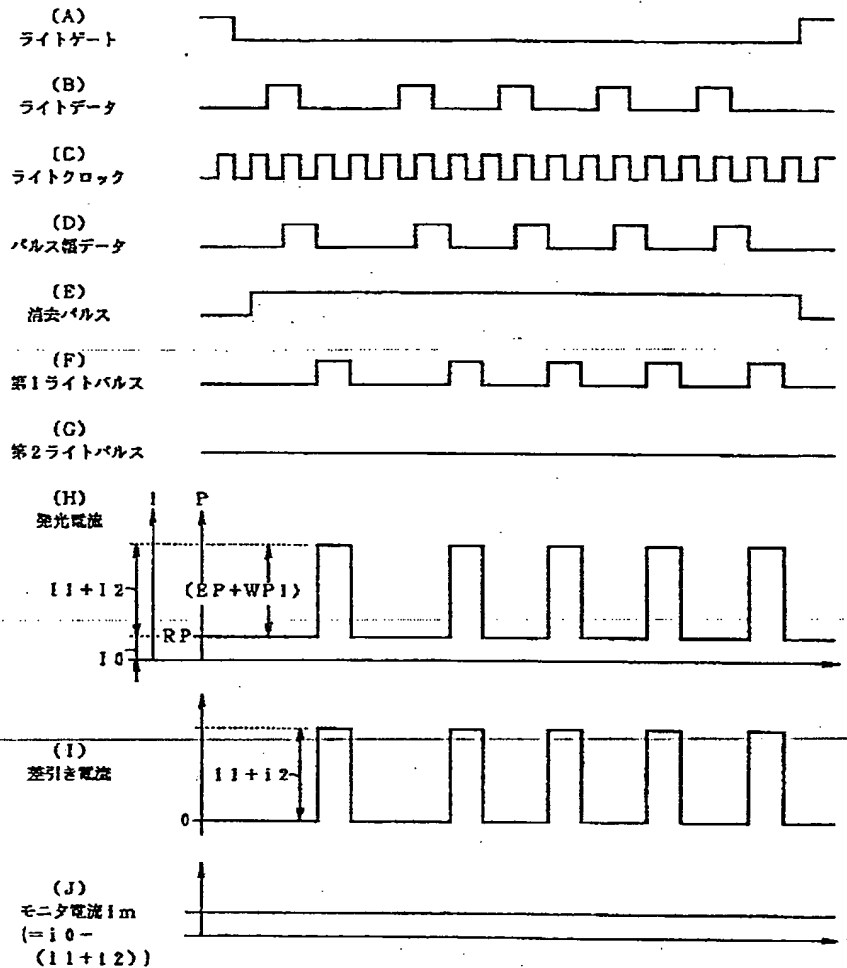
【図5】

本発明のPWM記録における信号、発光電流、差引電流及びモニタ電流のタイムチャート



【図6】

本発明のPPM記録における信号、発光電流、差引き電流及びモニタ電流のタイムチャート



【図9】

図7のデフォルトライトパワーテーブルの説明図

ゾーン番号 i	DWP i
1	6.0mW
2	6.5mW
3	7.0mW
4	7.5mW
5	8.0mW
6	8.5mW
7	9.0mW
8	9.5mW
9	10.0mW
10	10.5mW
11	11.0mW

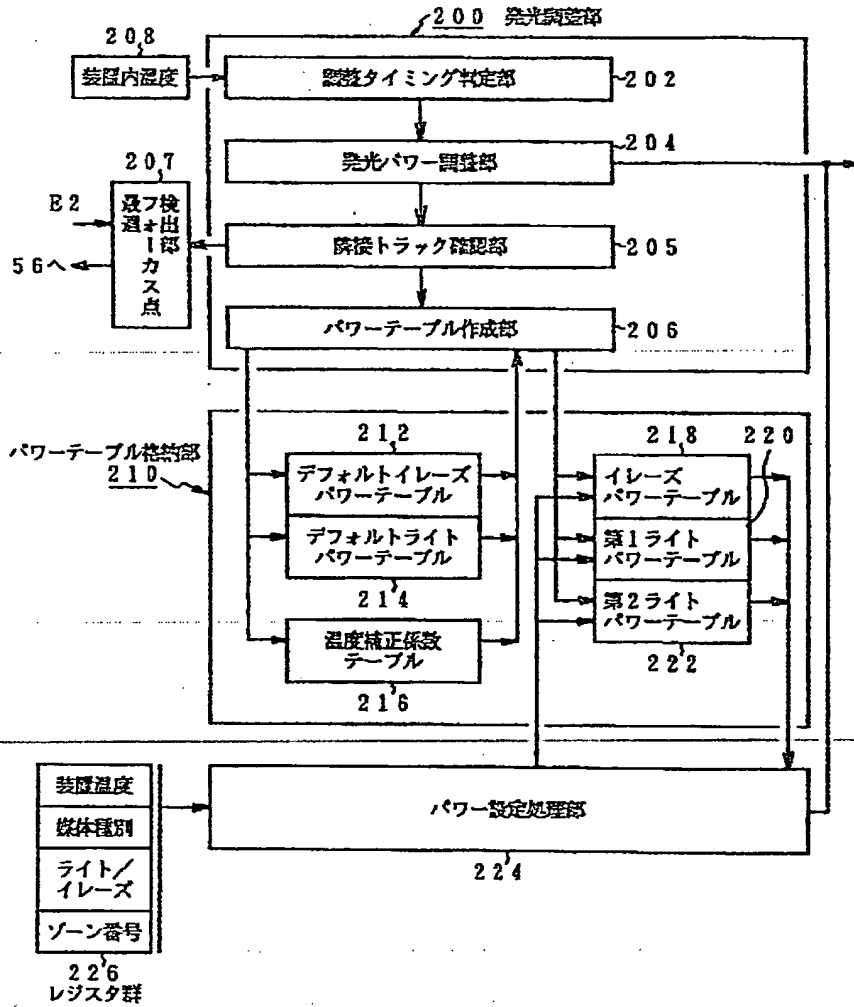
【図10】

図7の温度補正係数テーブルの説明図

ゾーン番号 i	Kt
1	-0.10
2	-0.08
3	-0.06
4	-0.04
5	-0.02
6	0.00
7	0.02
8	0.04
9	0.06
10	0.08
11	0.10

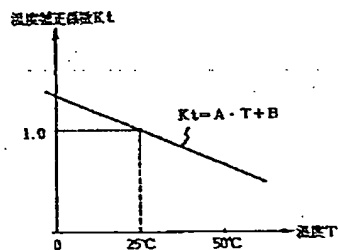
【図7】

図2のMPUで実現される発光ライトパワー調整部の機能ブロック図



【図16】

図14の限界パワーに加算して目標パワーを求めるオフセット比の温度を補正する温度補正係数の説明図



【図17】

図14の限界パワーに加算して目標パワーを求めるオフセット比のゾーン位置に対する補正係数の説明図

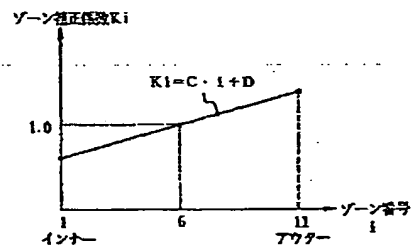
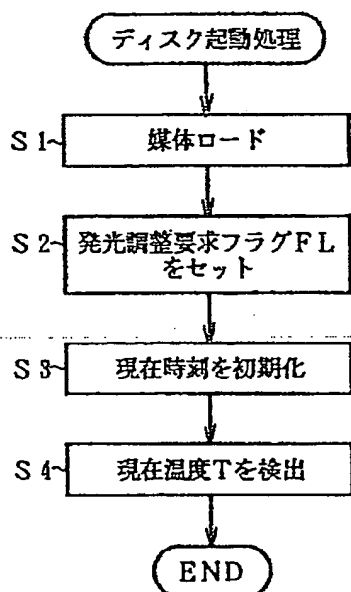
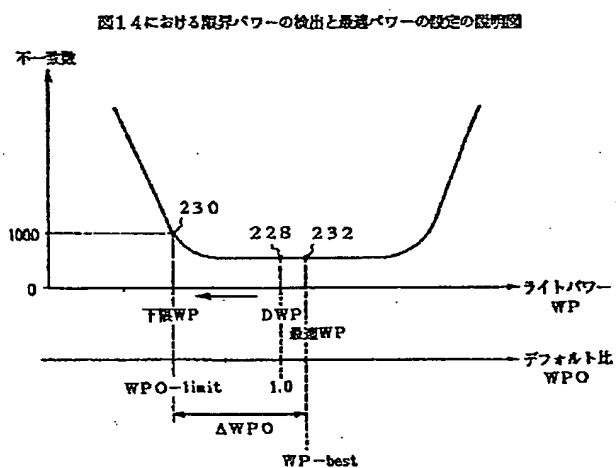


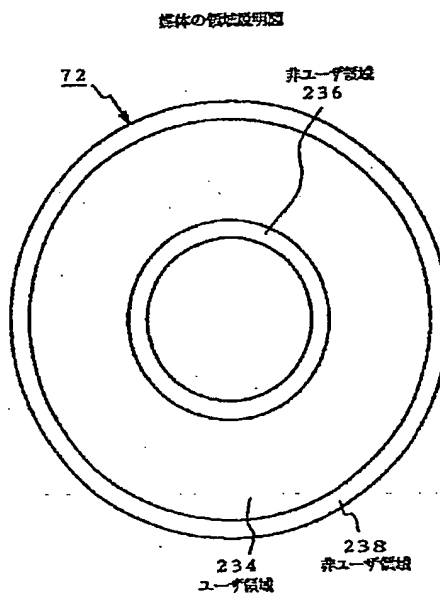
図7の発光パワー調整に先立つディスク起動処理のフローチャート



【圖 15】

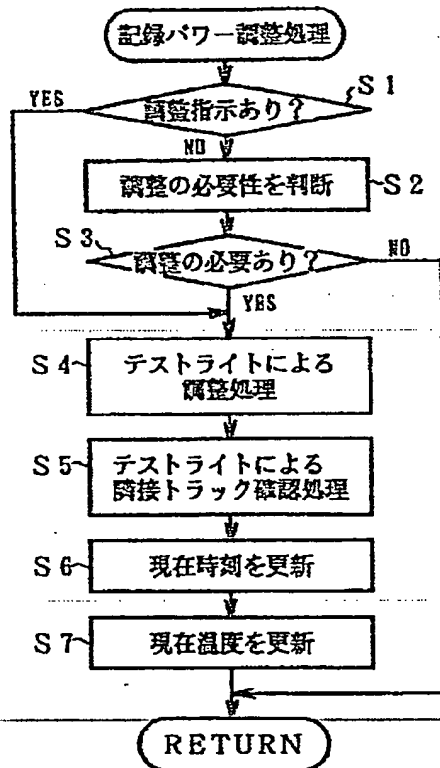


【图 18】



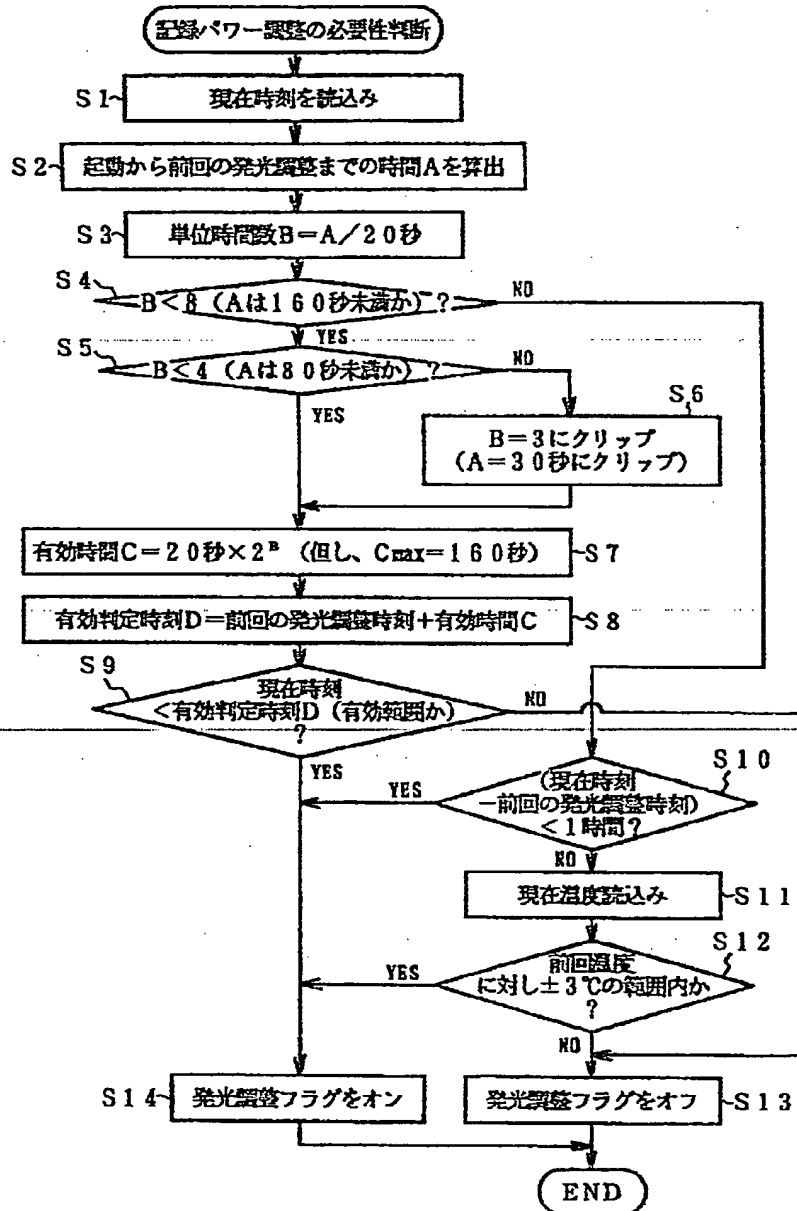
【図12】

図7の隣接トラック確認を含む記録パワー調整処理のフローチャート



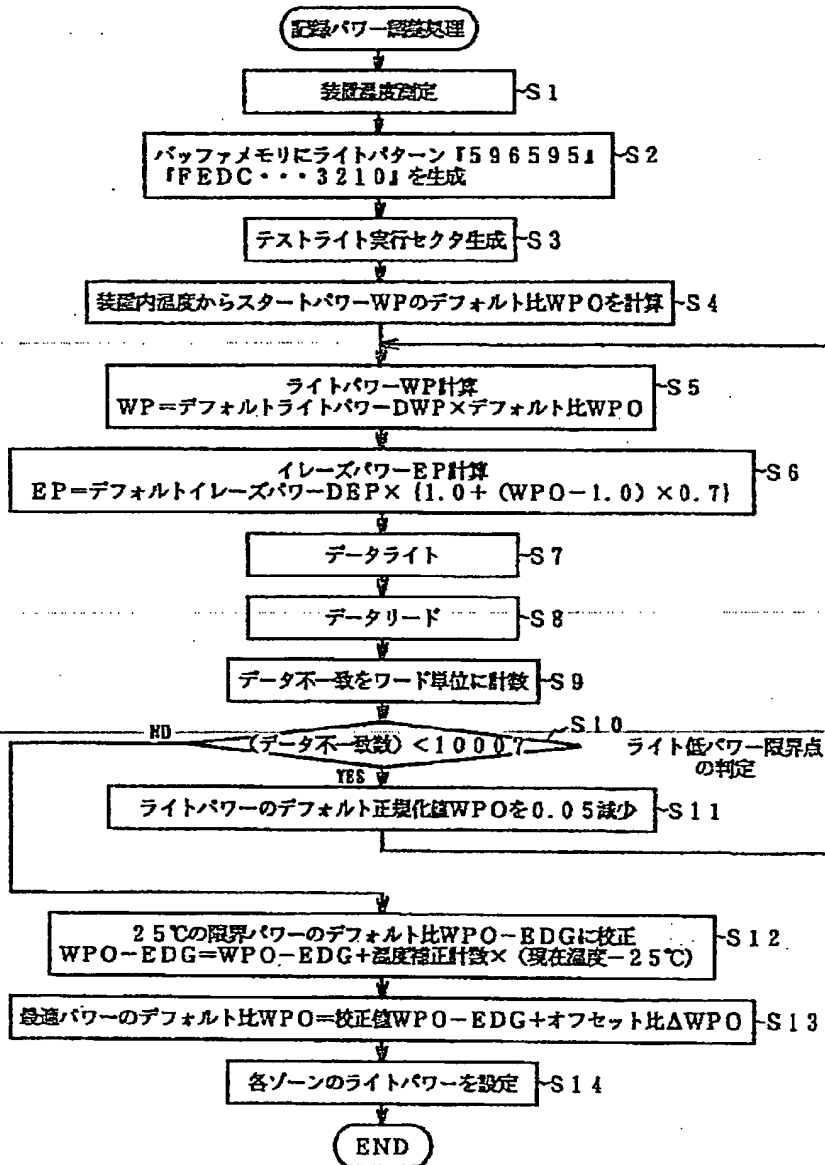
【図13】

図7の記録パワー調整の必要性判断のフローチャート

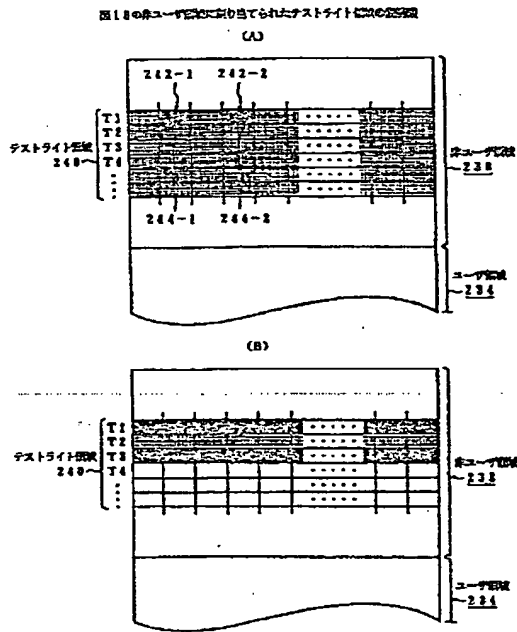


【図14】

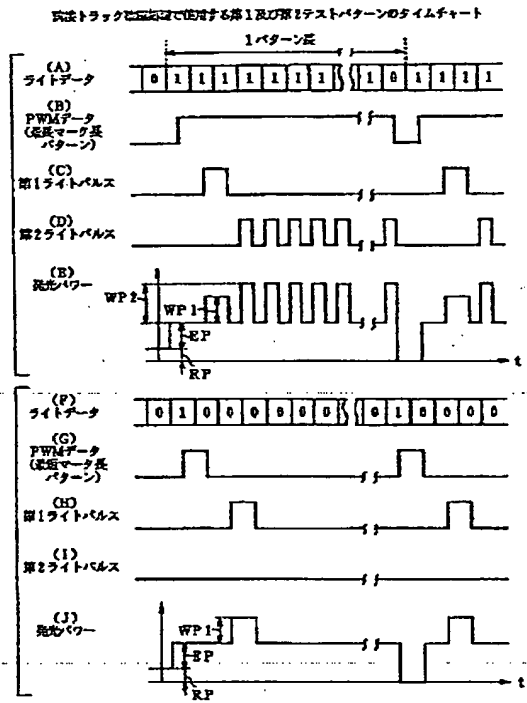
試し書きによる図7の記録パワー調整処理のフローチャート



【図19】

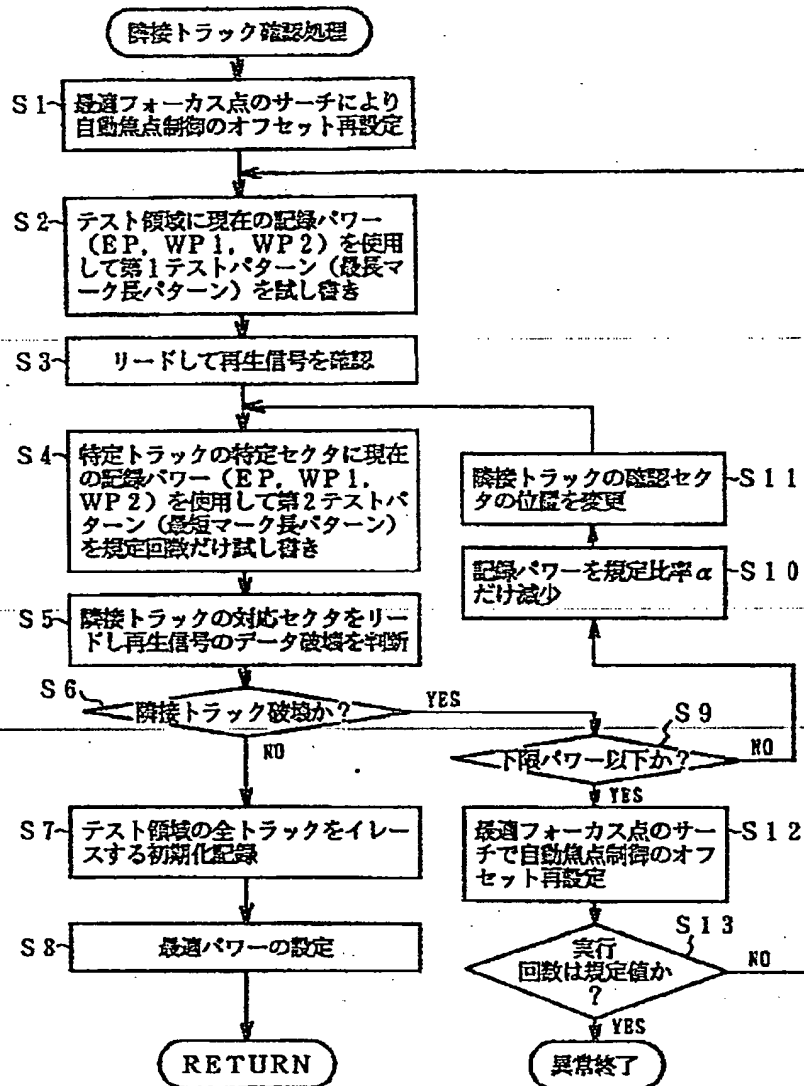


【図21】



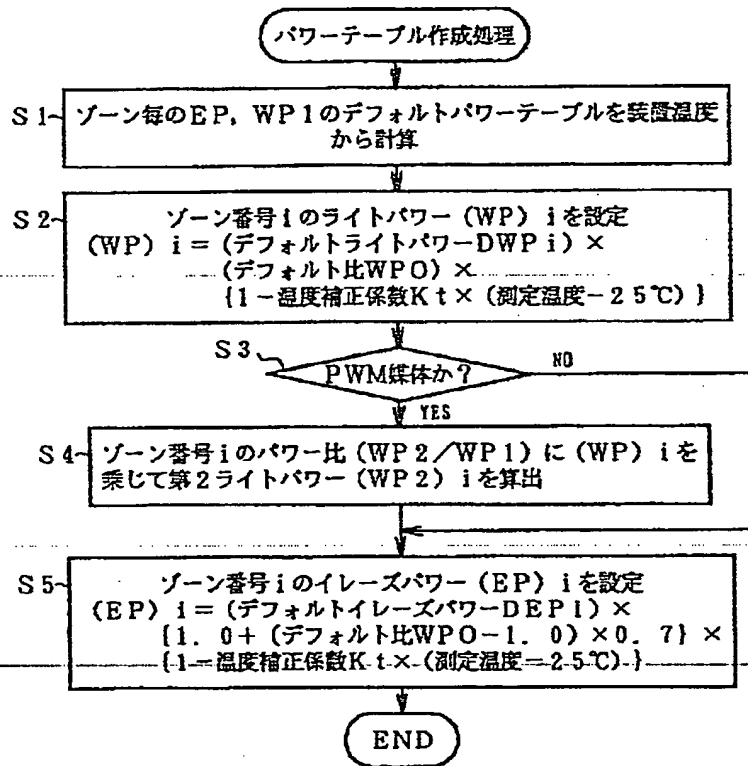
【図20】

図7の隣接トラック確認処理のフローチャート



【図22】

最適ライトパワーの調整結果を用いたパワーテーブル設定処理のフローチャート



フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁸

G11B 20/18

識別記号

501

572

FI

G11B 20/18

501A

572C

572F

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.